



中华人民共和国国家标准

GB/T 6218—1996
idt IEC 747-7-3:1991

开关用双极型晶体管空白详细规范

Blank detail specification for bipolar
transistors for switching applications

1996-07-09发布

1997-01-01实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准是根据国际电工委员会 IEC 747-7-3:1991《开关用双极型晶体管空白详细规范》对 GB 6218—86进行修订的。修订后的标准与 IEC 747-7-3 标准等同。

本空白详细规范是半导体器件空白详细规范系列中的一个，并应与下列规范一起使用：GB 4589.1—89《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》，GB 12560—90《半导体器件 分立器件分规范》。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市电子仪表标准计量测试所、中国电子技术标准化研究所。

本标准起草人：倪月琴、王长福。

IEC 前言

国际电工委员会(IEC)电工元器件质量评定体系遵循国际电工委员会的章程,且在国际电工委员会授权下开展工作。评定体系的目的是以这样一种方式确定质量评定程序,使得一个成员国按照符合适用规范要求所放行的电子元器件在其它所有成员国内无需再试验,同样为合格。

本空白详细规范是半导体器件一系列空白规范中的一个,同时使用下列 IEC 标准:

IEC 747-10/QC 700 000(1991)半导体器件 第 10 部分 分立器件和集成电路总规范

IEC 747-11/QC 750 100(1985)半导体器件 第 11 部分 分立器件分规范

中华人民共和国国家标准
开关用双极型晶体管空白详细规范
**Blank detail specification for bipolar
transistors for switching applications**

GB/T 6218—1996
idt IEC 747-7-3:1991

代替 GB 6218—86

要求的资料：

下列所要求的各项内容，应列入规定的相应空栏中
详细规范的识别：

- (1) 授权发布详细规范的国家标准机构名称。
- (2) IECQ 详细规范号。
- (3) 总规范号和分规范号以及年代号。
- (4) 详细规范号和发布日期，以及国家体系要求的任何更多资料。

器件的识别：

- (5) 器件的型号。
- (6) 典型结构和应用资料：如果设计一种器件满足若干应用，则应在详细规范中指出，这些应用的特性、极限值和检验要求应予满足。如果器件对静电敏感，或含有害材料例如：氧化铍，则应在详细规范中附加注意事项。
- (7) 外形图和(或)引用有关的外形标准。
- (8) 质量评定类别。
- (9) 能在器件型号之间比较的最重要的特性参考数据

[整个规范，括号内给出的条款供指导规范制订者使用，而不包括在详细规范里]。

[整个规范，特性或适用的额定值，用“×”表示，在详细规范中填入一个数值]。